

دانشکده مهندسی نساجی - دانشگاه صنعتی اصفهان

ساختمان فيزيكي الياف

دكتر مصطفى يوسفى

X-RAY DIFFRACTION



ساختمان فيزيكي الياف - دكتر مصطفى يوسفي

تاثیرات متقابل پرتو ایکس و مواد بلوری

- پراش -ديفراكسيون-
- German physicist: von Laue (1879-1960)
 - در بلورها اتمها به فواصل تكرارى كم و مشخصى قرار گرفته اند.
 - پرتو ایکس دارای ماهیت موج الکترو مغناطیسی است.
- فاصله اتمها تقريبا برابر طول موج پرتو ايكس است. پس بلورها بايد موجب پراش پرتو ايكس شوند.

پراش DIFFRACTION

 English Physicists: W. H. BRAGG (1862-1942) , W.L. BRAGG (1890-1971)

با استفاده از پراش و روابطی سا ده ساختار KCl, NaCl, KBrرا شناختند.

تداخل سازنده و مخرب (غیر سازنده)



Constructive Interference In Phase Destructive Interference Out Phase

پرتو ایکس در اثر برخورد به یک ماده بی نظم پراکنده می گردد.



در برخورد پرتو ایکس به صفحات یک ماده بلوری پراش اتفاق می افتد.



ساختمان فيزيكي الياف - دكتر مصطفى يوسفي

به دست آوردن قانون براگ



BRAGG LAW

 شعاع برخوردی، خط عمود بر سطح جسم ، شعاع منعکسه همه در یک صفحه قرار دارند.

اگر دیفراکسیون رخ داد زاویه بین شعاعی که برای آن پراش
اتفاق افتاده و شعاع اصلی همیشه برابر 20 است.

جون $\lambda < 2d$ پس باید $\sin \theta < 1$ باشد •

11

Wide Angle X-ray Scattering

- پراش پرتو ایکس زاویه زیاد WAXS
- $2d \sin \theta = n\lambda$ $n = 1 \rightarrow d = \frac{\lambda}{2\sin \theta}$

 $\lambda = 0.7A \longrightarrow \theta = 20^0 \longrightarrow d = ?$

Small Angle X-ray Scattering

• پراش پرتو ایکس زاویه کم SAXS

$\lambda = 0.7A \rightarrow \theta = 1^0 \rightarrow d = ? \qquad ^{20.05A}$

روشهای پراش

 $2d\sin\theta = n\lambda$ ۱- روش لائو (Laue) کر متغير و A ثابت است. - روش بلور چرخان λ ثابت و θ متغیر است. A روش پودری λ ثابت و Hمتغير است.

Laue Method



 بعضی دستگاه ها مجهز به دتکتور دوبعدی و یا فیلم هستند و می توانند از کل پرتو متفرق شده تصویر تهیه کنند. در این حالت نیازی به یودر کردن و یا خرد کردن الیاف نیست و الیاف معمولا روی یک قاب مخصوص پیچیدہ می شوند و در معرض يرتو ايكس قرار مي گيرند.



عکسهای پراش حاصل از الیاف















برای بدست آوردن داده های تفرق، زوایای مخروط های تفرق، heta باید تعیین شود.

Debye Scherrer Camera





یک نمونه پودری شامل صدها بلورینه می باشد. پرتو متفرق شده یک مخروط تشکیل می دهد. یک فیلم دایره ای برای ثبت طرح تفرق استفاده می شود. در اثر برخورد هر مخروط با فیلم، خطوط تفرق روی فیلم حاصل می شوند. این خطوط به صورت کمان هایی روی فیلم دیده می شوند.

Debye-Scherrer method



•با جایگزین کردن مقادیر θ در *ر*ابطه براگ، فاصله صفحات در شبکه (d) محاسبه می شود. •شدت پیک های تفرق *ر*وی فیلم نیز با داشتن مشخصات فیلم (مانند حساسیت فیلم) قابل محاسبه است.

$$\lambda$$
=2d_{hkl}sin θ _{hkl}

عکسهای حاصل با دستگاه د بی شرر





ساختمان فيزيكي الياف - دكتر مصطفى يوسفي





A Modern Automated X-ray Diffractometer



Cost:\$560Kito1.6M دما

Powder Diffractometer





ساختمان فيزيكي الياف - دكتر مصطفى يوسفى

طیف حاصل از دیفراکتومتر برای SiC







منحنی های شدت بر حسب زاویه پراش با بزرگ شدن اندازه باریک میشود

تعیین در صد یا شاخص تبلور



اطلاعات حاصل از پراش پرتو ایکس

- فاصله صفحات مشخصات سل واحد
 - درصد تبلور.
 - جهت گیری یا آرایش یافتگی بلورها.
 - اندازه بلورينه ها
- از اندازه گیری در زاویه کم، (SAXS)، تکرارها با فاصله زیاد اندازه قطر فیبریلها- ورقه ها به دست می آید





$$\rho V = \rho_c V_c + \rho_a V_a$$

درصد تبلور

$$\varphi_c = \frac{V_c}{V} = \frac{\rho - \rho_a}{\rho_c - \rho_a}$$
 نسبت حجمی تبلور

نسبت جرمی تبلور
$$X_c = \frac{m_c}{m} = \frac{\rho_c V_c}{\rho V} = \frac{\rho_c}{\rho} (\frac{\rho - \rho_a}{\rho_c - \rho_a})$$

آرایش بلوری

 آرایش بلوری از عکسهای پودری که الیاف در راستای مشخصی قرار گرفته اند به دست می آید.

$$f_c = (3 \langle \cos^2 \phi \rangle - 1) / 2$$



$$\left\langle \cos^{-2} \phi \right\rangle = \frac{\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} I(\phi) \cos \phi \cdot \sin \phi d\phi}{\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} I(\phi) \sin \phi d\phi}$$

$$= f_c$$
 ضريب آرايش بلورى f_c

·شدت اشخه ایکلین برای ضغحات مشخص **ا =**

XRD Pattern

Significance of Peak Shape in XRD

- 1. Peak position
- 2. Peak width
- 3. Peak intensity

